

DIN ISO 14997:2013-08 (D)

Optik und Photonik - Prüfverfahren für Oberflächenunvollkommenheiten optischer Komponenten (ISO 14997:2011)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort.....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Physikalische Grundlagen	7
5 Messung von abgeschatteten oder betroffenen Flächen.....	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Anforderungen.....	9
5.3 Kalibrierung	9
5.4 Verfahren	9
5.5 Prüfbericht	9
Anhang A (informativ) Inspektion des Bauteils	11
Anhang B (informativ) Empfohlene Maße von Artefakten auf der Skale einer Vergleichsplatte	12
Anhang C (informativ) Beschreibung des Instruments um Oberflächenunvollkommenheiten mit einer Größe unter 0,01 mm zu messen: Mikroskop-Bildkomparator.....	13
C.1 Kurzbeschreibung	13
C.2 Schematische Darstellung eines Komparators.....	13
C.3 Funktionsweise.....	14
Anhang D (informativ) Oberflächenunvollkommenheitsqualitätskontrolle	16
Anhang E (normativ) Bevorzugte Werte von Gradzahlen und Teilungsfaktoren.....	18
Literaturhinweise	19